

## Analyseverfahren bei nanoAnalytics

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die bei uns eingesetzten Analyse- und Präparationstechniken. Die Verfahren sind direkt am Standort Münster verfügbar bzw. werden im Rahmen langjähriger Kooperationen durch Partnerlaboratorien bereitgestellt.



**Für die Bearbeitung oberflächenanalytischer Fragestellungen werden von uns insbesondere folgende Methoden eingesetzt:**

- Rasterelektronenmikroskopie und Röntgenmikrobereichsanalytik (REM / EDX)
- Photoelektronenspektrometrie (ESCA / XPS)
- Sekundärionenmassenspektrometrie (TOF-SIMS)
- Optische Weißlichtprofilometrie
- Rasterkraftmikroskopie (AFM)
- Optische Mikroskopie (Fluoreszenz, Polarisation, DIC)

**Ergänzend bieten wir Ihnen auch die folgenden Methoden an:**

- Infrarotspektroskopie/-mikroskopie (FTIR / ATR)
- Kontaktwinkelmessungen
- Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
- Nano- und Mikroindentation
- Glimmentladungsspektroskopie (GDOS)
- Sekundärionen-Neutralteilchenmassenspektroskopie (SNMS)
- Mikro-Computertomographie

**Spezielle Präparationstechniken**

- Cryo-Brüche
- Ultramikrotomanschnitte  
(auch unter Cryo-Bedingungen)
- Erstellung von Quer- und Zielschliffen
- Präparation mittels Focussed Ion Beam (FIB)